MATEPIAЛИ ДЛЯ CEHCOPIB SENSORS MATERIALS

УДК 544.344.2

АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В ДВОЙНОЙ СИСТЕМЕ A² – B⁶ ZnTe

С. В. Ленков¹, О. В. Банзак², А. В. Карпенко¹

1 — Военный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко 03680, Киев, пр. Глушкова 2, корп. 8 2 — Одесская национальная академия связи имени А. С. Попова 65102, Одесса, ул. Кузнечная 1 E-mail: banzak@mail.ru

АНАЛИЗ ФАЗОВЫХ РАВНОВЕСИЙ В ДВОЙНОЙ СИСТЕМЕ A² – B⁶ ZnTe

С. В. Ленков, О. В. Банзак, А. В. Карпенко

Аннотация. В данной статье проведен анализ построенной P-T-X диаграммы Zn-Te системы методом оптической плотности паров. Были измерены парциальные давления цинка и теллура над твердым Zn-Te для составов от 40 до 55 ат.% Те до температуры 917°C.

Ключевые слова: диаграмма состояния, фазовые равновесия, оптическая плотность паров, теллур, цинк

АНАЛІЗ ФАЗОВИХ РІВНОВАГ У ДВІЙКОВІЙ СИСТЕМІ A² — B⁶ ZnTe

С. В. Лєнков, О. В. Банзак, О. В. Карпенко

Анотація. У даній статті проведено аналіз побудованої P - T - X діаграми системи *Zn-Те* методом оптичної густини пару. Були виміряні парціальні тиски цинку та телуру над твердим *Zn-Те* для складу від 40 до 55 ат.% Те до температури 917°C.

Ключові слова: діаграма стану, фазові рівноваги, оптична густина парів, телур, цинк

ANALYSIS PHASE BALANCES IN DOUBLE SYSTEM A² – B⁶ ZnTe

S. V. Lenkov, O. V. Banzak, A. V. Karpenko

Abstract. In given clause the analysis of the constructed P - T - X diagram of system *Zn-Te* by a method of optical density pairs is lead. Have been measured парциальные pressure of zinc and tellurium above firm *Zn-Te* for structures from 40 up to 55 at. % *Te* up to temperature 917°C.

Keywords: the diagram of a condition, phase balance, optical density παροβ, tellurium, zinc.

Вступление

В системах типа $A^2 - B^6$ образуется одно конгруэнтно плавящееся соединение эквиатомного состава. Температура плавления соединения, как правило, значительно превышает температуру плавления исходных компонентов. Вследствие высоких температур плавления соединений и больших давлений пара исходных компонентов изучение диаграмм состояния систем $A^2 - B^6$ связано с большими трудностями. К настоящему времени T - X проекции диаграмм состояния P - T - X построены для всех систем типа $A^2 - B^6$, за исключением Zn - S и Cd - S [1,2].

T-X проекция диаграммы P-T-X системы Zn-Te была исследована рядом авторов, данные которых находятся в хорошем согласии.

В системах Zn - Te и Cd - Te исследованы также P - T проекции диаграмм состояния.

Основная часть

В системе Zn-Te имеется одно соединение ZnTe, которое плавится при температуре 1290° С и образует вырожденные эвтектики со своими компонентами (рис. 1). Наличие острого максимуму, отвечающего составу соединения, указывает на взаимодействие между атомами цинка и теллура в расплаве. Вблизи 1210° С на кривой ликвидус со сторны цинка от стехиометрического состава наблюдается горизонтальный участок, который связывается с возможным расслаиванием в жидкой фазе. Растворимость теллура в жидком цинке изменяется от $3\cdot10^{-3}$ ат.% при 512° С до $(8\div9)\cdot10^{-2}$ ат.% при 910° С.

Построена P-T-X диаграмма системы Zn-Te методом оптической плотности паров. Были измерены парциальные давления цинка и теллура над твердым ZnTe для составов от 40 до 55 ат.% Te до температуры 917° С. Показано, что в области температур $500-910^{\circ}$ С парциальное давление цинка ρ_{Zn} над насыщенным цинком ZnTe (в пределах ошибки опыта оценивается \pm 2%) такое же, что и над чистым цинком; оно составляет 0,114 атм при 727° С и 1,17 атм при 917° С. Парциальное давление

теллура над насыщенным теллуром ZnTe (ρ_{Zn}) определялось в температурной области между 398 и 913° С; его величина несколько меньше давления паров чистого теллура, сильно зависит от температуры и составляет 0,03·10-4 атм при 398°C и 0,346 атм при 903°C. В пределах предполагаемой области гомогенности ZnTe (49,15-50,5 ат.% Te) давление паров цинка намного превышает давление паров теллура. Отношение ρ_{Zn} / ρ_{Te_2} составляет 4,58 при 710°C и 1,84 при 900°C.

P-T проекция диаграммы состояния P-T-X системы Zn-Te, по данным [3], показана на рисунке 1 (б). Приводятся парциальные давления теллура (в зависимости от обратной температуры) над ZnTe, насыщенным теллуром, для составов 50,5 и 55 ат.% Те. Как видно на рисунке 27б, линия трехфазного равновесия со стороны теллура почти совпадает с линией давления паров чистого теллура $\rho_{\text{Te}}^{\text{0}}$. Линия $ho_{\scriptscriptstyle{min}}$ характеризует изменение парциальных давлений компонентов над твердым ZnTe; особенность ее состоит в том, что линия $\rho_{\scriptscriptstyle min}$ дает сумму парциальных давлений ρ_{Zn} и ρ_{Te_2} при минимальном общем давлении в системе. Давление на линии ρ_{min} соответствует равновесию твер-дое тело ↔ пар при условии, что состав па-ра и твердой фазы одинаков ($\rho_{\text{Zn}} = 2\rho_{\text{Te}_3}$). Поскольку при этих условиях соотношение цинка и теллура в газовой фазе равно их соотношению в твердом ZnTe , линию ρ_{min} иначе называют сублимационной линией (или линией конгруэнтной сублимации).

Комбинируя данные, относящиеся к линиям ликвидуса и кривым давления пара и используя T-X проекцию, расчетным путем описали фазовые равновесия P-T-X в системе Zn-Te. Парциальные давления цинка на ликвидусом со стороны цинка и давления теллура на ликвидусом со стороны теллура вычислялись из закона Рауля. Парциальные давления паров цинка со стороны теллура и паров теллура над ликвидусом со стороны цинка вычислялись из константы равновесия K_p для реакции $ZnTe_{TB} \longrightarrow Zn_{T} + \frac{1}{2} Te_{2T}$, экспериментально найденной по методу Кнудсена, а давления

паров основного компонента, составляющего жидкую фазу, находили по уравнению $K_p = \rho_{Zn} \cdot \rho Te_2^{-1/2\ amm\ 3/2}$. При этом предполагалось, что область однородности на основе ZnTe так узка, что константа равновесия K_p не зависит от изменений состава в пределах области гомогенности.

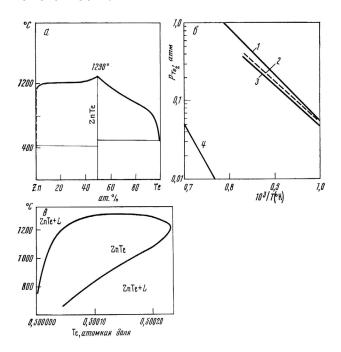


Рис. 1. P-T-X диаграмма состояния системы Zn-Te: а) проекция T-X; проекция P-T:1 — давление пара чистого теллура; 2 — парциальное давление пара теллура для сплава с 50,5 ат.% Te при температуре оптической ячейки 1000° C; 3 — то же, для сплава с 55 ат.% Te при 1100° C; 4 — линия ρ_{\min} , в) T-X проекция вблизи соединения ZnTe по расчетным данным

Прецизионные измерения параметра решетки в сплавах ZnTe, насыщенных Zn и Te соответственно, показали, что постоянная решетки сплавов, равная $6{,}1026 \pm 0{,}0001$ Å, практически не меняется. Область гомогенности, по экспериментальным данным по давлению паров, не должна превышать $0{,}2$ ат.%.

На основании данных по температурной зависимости давлении паров цинка, исходя из предположения о наличии двукратно ионизованных вакансий цинка, была рассчитана кривая солидус для соединения *ZnTe* пред-

ставлена на рисунке 1. Максимум на кривой ликвидус смещен в сторону теллура от стехиометрического состава ZnTe. При температуре 1200° С растворимость твердого теллура в ZnTe составляет $4,6\cdot10^{-3}$ ат.%. Кривая солидус имеет ретроградный характер и смещена в сторону избытка теллура. Ниже 600° С область однородности значительно ближе к стехиометрическому составу, чем при более высоких температурах. Эти данные хорошо согласуются с результатами электрических измерений.

ZnTe имеет p-тип проводимости, что обусловлено наличием собственных акцепторов, которыми являются двукратно иони-зованные вакансии цинка.

Выводы

- 1. Показано, что в области температур 500- 910° С парциальное давление цинка ρ_{Zn} над насыщенным цинком ZnTe (в пределах ошибки опыта оценивается \pm 2%) такое же, что и над чистым цинком; оно составляет 0,114 атм при 727° С и 1,17 атм при 917° С.
- 2. Прецизионные измерения параметра решетки в сплавах ZnTe, насыщенных Zn и Te соответственно, показали, что постоянная решетки сплавов, равная $6,1026 \pm 0,0001$ Å, практически не меняется. Область гомогенности, по экспериментальным данным по давлению паров, не должна превышать 0,2 ат.%.

Список использованной литературы

- Маслов О. В., Ленков С. В., Банзак О. В., Карпенко О. В. Погрешность измерения характеристик полей гамма-излучения детектором на основе CdZnTe // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — К., 2012. — № 36. — С.173 — 182.
- 2. Лєнков С. В., Банзак О. В., Карпенко О. В. Порівняльний аналіз методів отримання та управління властивостями телуридів цинку і кадмію// Нові технології. Кременчук, 2011. № 4(34). С. 3–10.
- 3. Большакова Г. В. Исследование влияния различных примесей на структурные

параметры кристаллов CdTe// Большакова Γ . В., Леднева Φ . И., Кутовой И. С., Устинов В. М.- Электронная техника. Серия 6: Материалы. — Вып. 2 (256), 1991. — С. 2326.